

JIS 管理システム/その他(部門Q,Z)

--- 2019-02 追録情報 ---

一般財団法人日本規格協会

制定・改正

規格番号	文書標題	文書標題(英文)	出版年月日	定価(本体価格)	状態	旧規格番号
JIS Z 4334:2019	放射性表面汚染モニタ校正用標準線源— α 線、 β 線及びX・ γ 線放出核種	Reference sources -- Calibration of surface contamination monitors -- Alpha-, beta- and photon emitters	H31.2.20	1,944円(本体1,800円)	出版— 改正	JIS Z 4334:2005
JIS Z 8210:2017/AMENDMENT 1:2019	案内用図記号(追補1)	Public information symbols (Amendment 1)	H31.2.20	1,080円(本体1,000円)	出版— 改正	
JIS Z 8785:2019	測光—CIE物理測光システム	Photometry -- The CIE system of physical photometry	H31.2.20	2,808円(本体2,600円)	出版— 制定	
JIS Z 8844:2019	微小粒子の破壊強度及び変形強度の測定方法	Test method of fracture and deformation strength of a fine particle	H31.2.20	1,944円(本体1,800円)	出版— 制定	

公表

規格番号	文書標題	文書標題(英文)	出版年月日	定価(本体価格)	状態	旧規格番号
	今回公表されたTR、TSはありません。					

廃止

規格番号	文書標題	文書標題(英文)	出版年月日	定価(本体価格)	状態	移行先
	今回廃止されたJISはありません。					